

UDC 621.382.33 : 621.371.3.08
L 42



中华人民共和国国家标准

GB/T 4587—94
IEC 747-7—1988

半导体分立器件和集成电路 第7部分：双极型晶体管

Semiconductor discrete devices and integrated circuits
Part 7: Bipolar transistors

1994-12-31发布

1995-08-01实施

国家技术监督局发布

目 次

第 I 章 总则

1 引言	(1)
2 范围	(1)
3 文字符号	(1)

第 II 章 术语和文字符号

1 晶体管的类型	(1)
2 通用术语	(2)
3 电路组态	(2)
4 有关额定值和特性的术语	(3)
5 S-参数	(5)
6 文字符号	(9)
6.1 电流、电压和功率的文字符号	(9)
6.2 电参数的文字符号	(9)
6.3 其他量的文字符号	(10)
6.4 文字符号一览表	(10)

第 III 章 基本额定值和特性

第 1 节 小功率信号晶体管(不包括开关用的)

1 概述	(22)
2 额定值(极限值)	(22)
3 特性	(23)
4 应用数据	(26)

第 2 节 功率晶体管(不包括高频和开关用晶体管)

1 概述	(26)
2 额定值(极限值)	(26)
3 特性	(27)
4 应用数据	(27)

第 3 节 放大器和振荡器用高频功率晶体管

1 类型	(27)
2 半导体材料	(27)
3 极性	(27)
4 外形	(27)
5 极限值(绝对最大额定值)(除非另有规定,指在工作温度范围内)	(28)
6 特性	(28)

7 补充资料	(31)
8 环境和(或)电耐久性试验资料	(31)

第 4 节 开关晶体管

1 概述	(31)
2 额定值(极限值)	(31)
3 特性	(31)
4 应用数据	(33)

第 IV 章 通用测试方法和基准测试方法

第 1 节 通用测试方法

1 概述	(33)
2 集电极-基极和发射极—基极截止电流	(33)
3 集电极-发射极截止电流(直流法)($I_{CEO}, I_{CER}, I_{CEX}, I_{CES}$)	(34)
4 集电极-发射极饱和电压(V_{CESat})	(34)
5 基极-发射极饱和电压(V_{BESat})	(36)
6 基极-发射极电压(直流法)(V_{BE})	(37)
7 集电极-发射极维持电压($V_{CEO(sus)}, V_{CER(sus)}$)	(38)
8 电容	(40)
8.1 共基极输出电容(C_{22b} 或 C_{ob})	(40)
8.2 集电极-基极电容(C_{cb})	(41)
9 混合参数(小信号和大信号)	(42)
10 电压额定值和限定工作电压的可测特性($V_{(BR)CBO}, V_{(BR)EBO}, I_{S/B}$)	(48)
11 热阻	(50)
12 开关时间($t_d, t_r, t_{on}, t_s, t_f, t_{off}$)	(59)
13 高频参数($f_T, C_{22b}, \operatorname{Re}(h_{11e}), y_{\dots}, e, s \dots$)	(61)
14 噪声系数(F)	(74)

第 2 节 基准测试方法

1 概述	(79)
2 集电极-基极截止电流(反向电流)(I_{CBO})	(80)
3 发射极-基极截止电流(反向电流)(I_{EBO})	(80)
4 集电极-发射极饱和电压(V_{CESat})	(81)
5 基极-发射极饱和电压(V_{BESat})	(83)
6 基极-发射极正向电压(V_{BE})	(83)
7 共发射极正向电流传输比的静态值(h_{21e})	(84)
8 低频小信号共发射极正向电流传输比(h_{21e})	(85)
9 开关参数	(87)

第 V 章 接收和可靠性

第 1 节 电耐久性试验

1 一般要求	(87)
2 特殊要求	(87)

2.1	耐久性试验一览表	(87)
2.2	耐久性试验条件	(87)
2.3	接收试验中判定失效的特性和失效判据	(87)
2.4	可靠性试验中判定失效的特性和失效判据	(87)
2.5	误试时的处理程序	(87)
表 I	耐久性试验后接收的判定失效特性	(87)
表 II	耐久性试验条件	(88)

中华人民共和国国家标准

半导体分立器件和集成电路 第7部分：双极型晶体管

Semiconductor discrete devices and integrated circuits
Part 7: Bipolar transistors

GB/T 4587—94
IEC 747-7—1988

代替 GB 4587—84
GB 6801—86

本标准等同采用国际标准 IEC 747-7—1988《半导体分立器件和集成电路 第七部分 双极型晶体管》。

第I章 总则

1 引言

通常,本标准与 IEC 747-1—1983《半导体分立器件和集成电路总则 第1部分 总则》一起使用。在 IEC 747-1 中可找到下列全部基础资料:

- 术语;
- 文字符号;
- 基本额定值和特性;
- 测试方法;
- 接收和可靠性。

本标准各章的编排顺序符合 IEC 747-1 第Ⅲ章第 2.1 条的规定。

2 范围

本标准给出了下列几种类型双极型晶体管的标准:

- 小功率信号晶体管(不包括开关用的);
- 功率晶体管(不包括开关和高频用的);
- 放大和振荡用高频功率晶体管;
- 开关用晶体管。

3 文字符号

通常,在术语的标题中加进了文字符号。当一个术语有几个文字符号时,本标准只选取了最常用的。

第Ⅱ章 术语和文字符号

1 晶体管的类型

1.1 结型晶体管 junction transistor

具有一个基区和两个或两个以上结的晶体管。

注: 结型晶体管的工作取决于注入到基区的少数载流子。